Typed or printed name

Approved for use through 10/31/2002. OMB 0651-0031
U.S. Patent and Trademark Office: U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

TRANSMITTAL FORM

(to be used for all correspondence after initial filing)

Application Number	10/604,686
Filing Date	08/11/2003
First Named Inventor	Han-Tu Lin
Group Art Unit	
Examiner Name	
Attorney Docket Number	ADTP0093USA

Total Number of Pages in This Submission 3 Attorney Docket Number PAD 11 0000001							
		ENCLOSURES (check all that apply)					
	claration(s) lequest ent Request ure Statement iority	Assignment Papers (for an Application) Drawing(s) Licensing-related Papers Petition Petition to Convert to a Provisional Application Power of Attorney, Revocation Change of Correspondence Address Terminal Disclaimer Request for Refund CD, Number of CD(s) After Allowance Communication to Group (Appeal Communication to Group (Appeal Notice, Brief, Reply Brief) Proprietary Information Status Letter Other Enclosure(s) (please identify below): Remarks					
	SIGNATU	JRE OF APPLICANT, ATTORNEY, OR AGENT					
Firm or Individual name Winston Hsu, Reg. No.: 41,526							
Signature Winston Hay							
Date Symptoms Say							
	CERTIFICATE OF MAILING						
I hereby certify that this commail in an envelope address	respondence is being sed to: Commissioner	deposited with the United States Postal Service with sufficient postage as first class for Patents, Washington, DC 20231 on this date:					

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 0.2 hours to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.

Date

SEP 0 3 2003 SEP 0

PTO/SB/17 (01-03)
Approved for use through 04/30/2003. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

FEE TRANS					
FEE IRANS	IVIIIIAL	Application Number	10/604,686		
for FY 2	0003	Filing Date	8/11/2003		
Effective 01/01/2003. Patent fees are sul		First Named Inventor	Han-Tu Lin		
		Examiner Name			
Applicant claims small entity status. See 37 CFR 1.27		Art Unit			
TOTAL AMOUNT OF PAYMENT	(\$) 0.00	Attorney Docket No.	ADTP0093USA		

METHOD OF PAYMENT (check all that apply)				FE	E CALCULATION (continued)	
Check Credit card Money Other None	3. AD	DITI	ONAL	FFF	S	
	Large E					
Deposit Account:	Fee	Fee	Fee	Fee	Fee Description	
Deposit Account 50-0801		(\$)		(\$)	•	Fee Paid
Number Deposit		130	2051		Surcharge - late filing fee or oath	
Account Name Name	1052	50	2052	25	Surcharge - late provisional filing fee or cover sheet	
The Commissioner is authorized to: (check all that apply)	1053	130	1053		Non-English specification	
Charge fee(s) indicated below Credit any overpayments	1812 2	2,520	1812	2,520	For filing a request for ex parte reexamination	├ ──
Charge any additional fee(s) during the pendency of this application	1804	920*	1804	920*	Requesting publication of SIR prior to Examiner action	
Charge fee(s) indicated below, except for the filing fee	1805 1	840*	1805	1 840*	Requesting publication of SIR after	
to the above-identified deposit account.	1000 /	1,040	1003	1,040	Examiner action	
FEE CALCULATION	1251	110	2251	55	Extension for reply within first month	
1. BASIC FILING FEE	1252	410	2252	205	Extension for reply within second month	
Large Entity Small Entity	1253	930	2253	465	Extension for reply within third month	
Fee Fee Fee Fee Description Fee Paid Code (\$)	1254 1	,450	2254	725	Extension for reply within fourth month	
1001 750 2001 375 Utility filing fee	1255 1	,970	2255	985	Extension for reply within fifth month	
1002 330 2002 165 Design filling fee	1401	320	2401	160	Notice of Appeal	
1003 520 2003 260 Plant filing fee	1402	320	2402	160	Filing a brief in support of an appeal	
1004 750 2004 375 Reissue filing fee	1403	280	2403	140	Request for oral hearing	
1005 160 2005 80 Provisional filing fee	1451 1	,510	1451	1,510	Petition to institute a public use proceeding	
SUBTOTAL (1) (\$) 0.00	1452	110	2452	55	Petition to revive - unavoidable	
	1453 1	,300	2453	650	Petition to revive - unintentional	
2. EXTRA CLAIM FEES FOR UTILITY AND REISSUE	1501 1	,300	2501	650	Utility issue fee (or reissue)	
Extra Claims below Fee Paid	1502	470	2502	235	Design issue fee	
Total Claims20** = X =	1503	630	2503	315	Plant issue fee	
Claims	1460	130	1460	130	Petitions to the Commissioner	
Multiple Dependent	1807	50	1807	50	Processing fee under 37 CFR 1.17(q)	
Large Entity Small Entity Fee Fee Fee Fee Fee Description	1806	180	1806	180	Submission of Information Disclosure Stmt	
Code (\$) Code (\$)	8021	40	8021	40	Recording each patent assignment per property (times number of properties)	
1202 18 2202 9 Claims in excess of 20	1809	750	2809	375	Filing a submission after final rejection	
1201 84 2201 42 Independent claims in excess of 3 1203 280 2203 140 Multiple dependent claim, if not paid	4040	750	0010		(37 ČFR 1.129(a))	
1204 84 2204 42 ** Reissue independent claims	1810	750	2810	3/5	For each additional invention to be examined (37 CFR 1.129(b))	
over original patent	1801	750	2801	375	Request for Continued Examination (RCE)	
1205 18 2205 9 ** Reissue claims in excess of 20 and over original patent	1802	900	1802	900	Request for expedited examination of a design application	
SUBTOTAL (2) (\$) 0.00	Other fe	ee (spe	ecify) _			
**or number previously paid, if greater; For Reissues, see above	*Reduc	ed by	Basic F	Filing F	ee Paid SUBTOTAL (3) (\$) 0.00	

or namber previous	siy paid, ii greater, i	or neissues,	see above				- 000101A	(Φ) 0.00	
SUBMITTED BY							(Complete	if applicable)	$\overline{}$
Name (Print/Type)	Winston Hsu		, _	\checkmark	Registration No. (Attorney/Agent)	41,526	Telephone	886289237350	
Signature		W	ln	lo	nsta	11	Date	8/29/20	3

WARNING: Information on this form may become public. Credit card information should not be included on this form. Provide credit card information and authorization on PTO-2038.

This collection of information is required by 37 CFR 1.17 and 1.27. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.

PTO/SB/02B (11-00)

Approved for use through 10/31/2002. OMB 0651-0032

U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

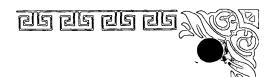
Under the Part of the Part

DECLARATION — Supplemental Priority Data Sheet

Additional foreign app	olications:			
Prior Foreign Application Number(s)	Country	Foreign Filing Date (MM/DD/YYYY)	Priority Not Claimed	Certified Copy Attached? YES NO
092113643	Taiwan, R.O.C.	05/20/2003		
1				

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 21 minutes to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.





中華民國經濟部智慧財產局

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS REPUBLIC OF CHINA

茲證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本,正確無訛,

其申請資料如下

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which is identified hereunder:

申 請 日: 西元 2003 年 05 月 20 日

Application Date

申 請 案 號: 092113643

Application No.

申 請 人: 友達光電股份有限公司

Applicant(s)

局 長 Director General



發文日期: 西元 2003 年 8 月 4 日

Issue Date

發文字號: 09220783840

Serial No.





申請日期:	IPC分類
申請案號:	

以上合懶	由本局填言	發明專利說明書
	中文	有機發光顯示器之薄膜電晶體的製作方法
發明名稱	英文	METHOD FOR FORMING A THIN FILM TRANSISTOR OF AN ORGANIC LIGHT EMITTING DISPLAY
	姓 名 (中文)	1. 林漢塗
. , =	姓 名 (英文)	1.Lin, Han-Tu
發明人 (共2人)	國 籍 (中英文)	1. 中華民國 TW
(), = / - /	住居所 (中 文)	1. 台中縣梧棲鎮自立一街二五0號
	住居所 (英文)	1. No. 250, Chih-Li 1st St., Wu-Chi Town, Tai-Chung Hsien, Taiwan, R.O.C.
	名稱或 姓 名 (中文)	1. 友達光電股份有限公司
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	名稱或 姓 名 (英文)	1. AU Optronics Corp.
=	國 籍 (中英文)	1. 中華民國 TW
申請人 (共1人)	住居所 (營業所) (中 文)	1. 新竹市新竹科學工業園區力行二路一號 (本地址與前向貴局申請者相同)
· ·	住居所 (營業所) (英 文)	
	代表人 (中文)	1. 李焜耀
	代表人(英文)	1. Lee, Kuen-Yao

申請日期:	IPC分類
申請案號:	
	·

(以上各欄	由本局填電	發明專利說明書
_	中文	
發明名稱	英文	
	姓 名(中文)	2. 來漢中
-	姓 名 (英文)	2. Lai, Han-Chung
發明人 (共2人)	國 籍 (中英文)	2. 中華民國 TW
	住居所 (中 文)	2. 桃園縣中壢市內壢成功路一二二巷六十三弄二十號
	住居所 (英 文)	2. No. 20, Alley 63, Lane 122, Cheng-Kung Rd., Nei-Li, Chung-Li City, Tao-Yuan Hsien, Taiwan, R.O.C.
	名稱或 姓 名 (中文)	
	名稱或 姓 名 (英文)	
Ξ	國 籍 (中英文)	
甲請人(共1人)	住居所 (營業所) (中 文)	
	住居所 (營業所) (英 文)	
	代表人 (中文)	
	代表人(英文)	



四、中文發明摘要 (發明名稱:有機發光顯示器之薄膜電晶體的製作方法)

五、(一)、本案代表圖為:第 六 圖 (二)、本案代表圖之元件代表符號簡單說明

40 基板

42 閘極

六、英文發明摘要 (發明名稱:METHOD FOR FORMING A THIN FILM TRANSISTOR OF AN ORGANIC LIGHT EMITTING DISPLAY)

A method for forming a thin film transistor (TFT) of an organic light emitting display is povided. The method comprises providing a substrate, depositing a first metal layer, performing a photo-etching-process (PEP) to form a gate of the TFT on the substrate, forming a gate insulating layer, a microcrystalline silicon layer, an amorphous silicon layer, and a doped n⁺



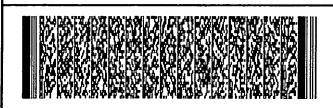


四、中文發明摘要 (發明名稱:有機發光顯示器之薄膜電晶體的製作方法)

44 閘 極 絕 緣 層 46 微晶矽層 48 非晶矽層 50 掺雜半導體層 52 氧化銦錫層 源 極 54 汲 極 56 - 58 保護層 60 有機發光層

六、英文發明摘要 (發明名稱:METHOD FOR FORMING A THIN FILM TRANSISTOR OF AN ORGANIC LIGHT EMITTING DISPLAY)

layer sequentially, then performing a second PEP to remove portions of the doped n⁺ layer, the algrphous silicon layer, and the microcrystalline silicon layer, forming a second metal layer, performing a third PEP to form a source and a drain on the substrate, to remove portions of the doped n⁺ layer to expose the amorphous silicon layer, and finally forming a passivation layer on



四、中文發明摘要 (發明名稱:有機發光顯示器之薄膜電晶體的製作方法)

六、英文發明摘要 (發明名稱:METHOD FOR FORMING A THIN FILM TRANSISTOR OF AN ORGANIC LIGHT EMITTING DISPLAY)

the substrate.



一、本案已向			
國家(地區)申請專利	申請日期	案號	主張專利法第二十四條第一項優先權
•			
		無	
	•		
二、□主張專利法第二十五	條之一第一項優	先權:	
申請案號:		無	
日期:		,,,,	
三、主張本案係符合專利法	第二十條第一項[]第一款但書或□第	二款但書規定之期間
日期:			
四、□有關微生物已寄存於	·國外:		
寄存國家:		無	
寄存機構: 寄存日期:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
寄存號碼:			
□有關微生物已寄存於	·國內(本局所指定	(之寄存機構):	
寄存機構:			
寄存日期:		無	
寄存號碼:			
□熟習該項技術者易於	獲得,不須寄存。		
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	·	· 	
		•	
		•	
			•

五、發明說明(1)

發明所屬之技術領域

本發明係關於一種有機發光顯示器(organic light emitting display)之薄膜電晶體(thin film transistor, TFT)的製作方法,尤指一種能改善薄膜電晶體之閘極啟始電壓飄移問題的薄膜電晶體製作方法。

先前技術

隨著科技的日新月異,輕薄、省電、可攜帶式的智慧 2 資訊產品已經充斥了我們的生活空間,而顯示器直質 在其間扮演了相當重要的角色。近年來顯示器在高畫質、大畫面、低成本的需求下已有很大進步,簡單的架構和具備自發光、極佳的工作溫度、高解析度、高對比、廣視角等優勢,已逐漸在顯示器市場中受到矚目,甚至有凌駕於液晶顯示器 (liquid crystal display, LCD)或是陰極射線管 (cathode ray tube, CRT)顯示器之上的趨勢,可運用在手機、PDA、數位相機、掌上型遊戲機、攜型 DVD播放機及汽車導航器等面板上。

有機發光顯示器係利用有機發光元件 (例如有機發光二極體, organic light emitting diode, OLED)為顯示器之光源,由於有機發光元件本身為一電流驅動元件,





五、發明說明(2)

能根據所通過電流之大小產生不同亮度的光線,故在矩陣式顯示器中,即是藉由控制有機發光元件之驅動電流的大小,來達到顯示不同亮度(又稱為灰階值)的效果,因此有機發光顯示器可充分利用此種特性來產生不同灰階強度的紅、藍、綠光,進一步使顯示器產生色彩豐富的影像。

而根據驅動方式之差異,有機發光顯示器可分為被動式矩陣 (passive matrix)顯示器與主動式矩陣 (active matrix)顯示器兩種。被動式矩陣顯示器是採用循序驅動掃 i線的方式,逐一驅動位於不同行 /列上的畫素,因此每一行 /列上的畫素之發光時間會受限於顯示器之掃描頻率以及掃描線數目,較不適用於大畫面以及高解析度(表示掃描線增加)之顯示器。主動式矩陣顯示器則於每一個畫素中形成獨立的畫素電路,包括一電容器(capacitor, Cs)、一 OLED發光元件以及至少二薄膜電晶體,以利用畫素電路來調節 OLED之驅動電流的大小,因此即使在大畫面以及高解析度之要求下,仍然可以持續提供每一畫素一穩定驅動電流,改善顯示器之亮度均勻性。

請參考圖一,圖一為習知一主動矩陣式有機發光顯示器 10之基本架構圖。如圖一所示,一顯示面板 12上包含有由複數行資料線 (例如 DL1、 DL2及 DL3)與複數列掃描





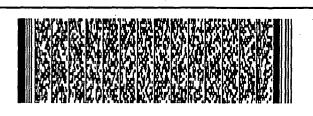
五、發明說明 (3)

線 (例如 SL1與 SL2)所構成的矩陣,以及複數個由薄膜電晶體、電容以及有機發光元件等電子元件 (未顯示)所構成之畫素電路 26,分別設置於每一條資料線與每一條掃描線的交會處。為便於說明,圖一中僅顯示一個畫素電路 26,實際上,顯示面板 12中每一條資料線 22與掃描線 24的交接處 (intersection)均設有一畫素電路 26,分別電連接到對應的資料線 22與掃描線 24,且每一畫素電路 26均係對應於一個畫素,以驅動該畫素內的有機發光元件 20。資料線 DL1、 DL2及 DL3等係連接至一外部資料線驅動電路 16,以接收一影像資料信號,而掃描線 SL1與 SL2等 刊係連接至一外部掃描線驅動電路 18,以接收一開關/定址信號。

請參考圖二,圖二為圖一所示畫素電路 26之電路示意圖。如圖二所示,畫素電路 26包含有一第一薄膜電晶體 28、一第二薄膜電晶體 30以及一儲存電容 32,在習知技術中,第一、第二薄膜電晶體一般係使用 NMOS電晶體。其中第一電晶體 28之 閘極與 汲極 (點 A)係 分別 電連接於掃描線 24與資料線 22,第二電晶體 30之 閘極 (點 B)係電連接於第一電晶體 28之 源極與儲存電容 32之一端,且第二電晶體 30之源極 (點 C)與 汲極 (點 D)分別 電連接到一外部電源 Va與有機發光元件 20。

習知有機發光顯示器 10的驅動原理係說明如下,請





五、發明說明(4)

参考圖一與圖二,當一影像資料信號輸入控制電路 14時,控制電路 14會根據各畫素所需要顯示的資料產生相對應的控制信號並分別輸入資料線驅動電路 16及掃描線驅動電路 18將依序對每一條掃描線 24 (SL1~SLn)送出對應的掃描信號,以依次開啟各列畫素電路 26,並對各列畫素進行顯示操作。例如當有機發光顯示器 10欲驅動位於 DL3與 SL3交會處之畫素時,控制電路 14會經由掃描線 22將一掃描信號輸入畫素電路 26中第一薄膜電晶體 28的汲極。輸入畫素電路 26中第一薄膜電晶體 28的汲極。

由於此時第一薄膜電晶體 28與第二薄膜電晶體 30均會處於導通狀態,因此來自資料線 22處之電流將會經 第一薄膜電晶體 28對儲存電容 32進行充電,使儲存電容 32具有一電壓,並在點 C處產生一相對應的驅動電流輸出至有機發光元件 20,以使有機發光元件 20產生對應之亮度。而當顯示器 10進行後續顯示操作時,例如驅動下一行畫素時,雖然掃描線 SL3上的電壓將下降而使第一第一電壓,因此第二電晶體 30將會被維持在導通狀態,又由於點 D與點 C間具有一電壓差,因此會持續產生電流經由第二薄膜電晶體 30輸出至有機發光元件 20,使有機





五、發明說明 (5)

發光元件 20持續維持在發光狀態。由於畫素電路設計結構之不同,在一畫素電路中所含有之薄膜電晶體的數量也不盡相同,但一畫素電路至少含有二薄膜電晶體,以完成有機發光元件之驅動。

由上述有機發光顯示器之驅動原理可知,負責驅動有機發光元件之畫素電路為一有機發光顯示器是否能即時顯示出完整及正確資料畫面的關鍵之一,而薄膜電晶體又為畫素電路中主要控制畫素電路導通與否及供應有機發光元件持續發光的重要元件,因此薄膜電晶體的良莠。

習知有機發光顯示器之畫速電路所使用的薄膜電晶體一般為NMOS電晶體,其製程係先在一玻璃基底上形成一閘極,再依序覆蓋以一閘極絕緣 (gate insulating layer, GI)層、一非晶砂 (amorphous silicon)層以及一掺雜 (doped)半導體層 (n layer), 並移除部分之該摻雜半導體層及該非晶砂層以定義出該閘極圖案。隨後再於該玻璃基底上形成一氧化銦錫 (indium tin oxide, ITO)層,移除部份之氧化銦錫層以形成畫素電極。接著於該層半導體層上形成一金屬層,再進行一黃光暨蝕刻製程,去除部份之該金屬層與該摻雜半導體層,形成該薄膜電晶體之一源極與一汲極,並同時曝露出部分之該非晶矽層。最後在該源極與汲極上形成一保護層





五、發明說明 (6)

(passivation layer),並去除部份之保護層,便完成該有機發光顯示器之該薄膜電晶體之製作。

然而由於在習知薄膜電晶體之製作方法中,該非晶矽層係由未結晶之形構成,因此也之外,以非晶矽材料所製作的薄膜電晶體之間極啟始電壓(threshold voltage)會隨著製程變動而飄移(shift),因此導致在同一有機發光顯不不同的薄膜電晶體之一,因此導致在同一有機發光面同同轉電品體之一,產生生的的現象。尤其當電子不可以表現,產生的,不但會造成,所以其當。於其當是於長時間,,不但會造成,而且會該薄膜電晶體之間,也是一個人。於其當一個人。於其當是一個人。於其其電晶體之間,是一個人。於其其電晶體之間,是一個人。於其其電晶體之間,是一個人。於其其電晶體之間,是一個人。於其其電晶體之間,是一個人。

現階段的OLED製造商大多是引進低溫多晶矽薄膜電晶體 (low temperature polysilicon thin film transistor, LTPS TFT)的製程,來改善原薄膜電晶體閘極起始電壓飄移之問題,然而因為LTPS TFT之製程相對較複雜,良率不高,造價亦相對較為昂貴,故在有機發光顯示器之製造中,如何以簡單、低成本之含氫的非晶





五、發明說明 (7)

矽層 (hydrogenated amorphous silicon layer, α -Si: layer)製程來生產出提供穩定閘極起始電壓之薄膜電晶體為當前業界急需解決的問題。



發明內容

因此本發明之目的在於提供一種有機發光顯示器之薄膜電晶體的製作方法,以解決上述因閘極啟始電壓飄移而造成亮度不均的問題。



最後於該基板上形成一保護層。



五、發明說明 (8)

由於本發明之薄膜電晶體的製作方法係以簡單之製程,在閘極絕緣層上多形成一微晶矽層,因此可以避免習知技術中,薄膜電晶體之閘極起始電壓飄移之情形,如此,則可改善有機發光顯示器之顯示品質,進而延長顯示器之壽命。

實施方式

請參閱圖三至圖六,圖三至圖六為本發明形成一有機、光顯示器之一薄膜電晶體的方法示意圖。如圖三所示,首先在基板 40上沈積一第一金屬層,並對該金屬層進行一第一黃光暨蝕刻製程,以於基板 40表面形成該薄膜電晶體之一閘極 42。其中,基板 40係為一玻璃基板、石英基板或塑膠基板,而構成閘極 42之材料包含有鎢(W)、鋁(A1)、鉻(Cr)、銅(Cu)、鉬(Mo)或上述各金屬之合金。

接著於閘極 42上形成一由氧化矽 (silicon oxide, SiO_x , 例如 SiO_2)、氮化矽 (silicon nitride, SiN_y)或氮氧化矽 (oxynitride, SiON)所構成之閘極絕緣層 44,然後再於閘極絕緣層 44上依序形成一微晶矽層 46、一非晶矽層 48以及一掺雜半導體層 $(n^+ layer)$ 50。其中閘極絕緣層 44、微晶矽層 46及非晶矽層 48係皆利用同一電漿增





五、發明說明 (9)

強化學氣相沈積製程連續沈積形成。

接著,如圖四所示,進行一第二黃光暨蝕刻製程,以去除部份之掺雜半導體層 50、非晶矽層 48及微晶矽層 46。然後於基板 40上形成一氧化銦錫 (indium tin oxide, ITO)層 52,並隨即進行一第三黃光暨蝕刻製程,以移除部份之氧化銦錫層 52。如圖五所示,接著再於基板 40上形成一曲鎢、銘、銅、鉬或上述各金屬之合金所構成之金屬層與摻雜半導體層 50,以形成該薄膜電晶 2之一源極 54與一汲極 56,並同時曝露出非晶矽層 48。最後,如圖六所示,於基板 40上形成一曲氧化 刻製程,去除部份之保護層 58,並進行一第五黃光鹽蝕刻製程,去除部份之保護層 58,以完成該有機發光顯示器之該薄膜電晶體之製作。隨後再於基板 40上繼續進行諸如沈積有機發光層 (OLED layer) 60等步驟,逐一完成該有機發光顯示面板的後續製程。

值得注意的是,在本發明中,微晶矽層 46之厚度係以約 50~ 500埃為較佳,而且以電漿增強化學氣相沈積製程形成微晶矽層 46時,該電漿增強化學氣相沈積製程的功率密度 (power density)需控制在小於 0.54瓦特 /平方公分的條件為較佳。此外,微晶矽層 46之結晶比率 (f_c)必須大於 40%才能達到電性穩定的要求,此可利用傅立葉轉





五、發明說明 (10)

换紅外線光譜儀 (FTIR)之 2100公分 一级 1900 公分 一级 收峰的積分面積比計算所得,其公式如下:



$f_c = I_{2100}/(I_{2100}+I_{1900})$

在本發明製作一有機發光顯示器之一薄膜電晶體之方法的第二實施例中,係在完成開極絕緣層 44沈積後,先對開極絕緣層 44進行一表面處理製程,再繼續沈積總晶矽層 46。進行該表面處理製程的原因是由於在開極絕緣層 44與微晶矽層 46之介面中,若含有較多的含氧分別會有利於微晶矽層 46之形成,因此本發明便利用一輕微之氧化氮電漿處理製程(N2O plasma treatment),以使問極絕緣層 44能和形成於其上的微晶矽層 46之間有較強的氧鍵結,而達到介面穩定的效果中,該表面處理製程也可以利用一含氧電漿處理製程(oxide plasma treatment),亦能使開極絕緣層 44和微晶矽層 46之介面部分有較強的氧鍵結,而該含氧電漿處理製程所使用的含氧氣體可為一氧化氮(NO)、二氧化氮(NO2)、二氧化氮(H2O2)、氧(O2)、臭氧(O3)或四乙氧基矽烷(TEOS)等氣體。

在本發明之第三實施例中,閘極絕緣層 44以及微晶矽層 46係以非連續程序沈積形成。例如在利用電漿增強化學氣相沈積製程形成閘極絕緣層 44之後,先將基板 40





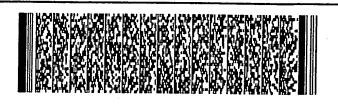
五、發明說明 (11)

移出原反應室 (chamber),然後再將基板 40移至同一反應室或不同反應室,繼續進行微晶矽層 46之沈積。以此程序所製作之微晶矽層 46,可使薄膜電晶體具有穩定性較佳之性質,而能有效達到降低閘極起始電壓之飄移的效果。



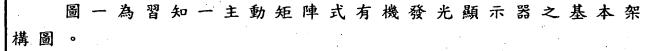
以上所述僅為本發明之較佳實施例,凡依本發明申請專利範圍所做之均等變化與修飾,皆應屬本發明專利之涵蓋範圍。





圖式簡單說明

圖式之簡單說明



圖二為圖一所示畫素電路之電路示意圖。

圖三至圖六為本發明形成一有機發光顯示器之一薄 膜電晶體的方法示意圖。

圖式之符號說明

10	有	機	發	光	顯	示	器
14	控	制	電	路	. 3		

- 22^{-} 資料線
- 26 畫素電路
- 30 第二薄膜電晶體 32 储存電容
- 基 板 40
- 開極絕緣層 44
- 48 非晶矽層
- 氧化 銦 錫 層 52
- 汲 極 56
- 60有機發光層

- 12 顯示面板
- 16 資料線驅動電路
- 18 掃描線驅動電路 20 有機發光元件
 - 掃 描 線 24
 - 28 第一薄膜電晶體
 - 42 閘 極
 - 46 微晶矽層
 - 5 0 掺雜半導體層
 - 54 源極
 - 58 保護層



1. 一種有機發光顯示器之薄膜電晶體的製作方法,該方法包含有下列步驟:

提供一基板;

於該基板上沈積一第一金屬層;

對該第一金屬層進行一第一黃光暨蝕刻製程,以於該基

板表面形成該薄膜電晶體之一閘極;

於該 閘極表面形成一 閘極絕緣層;

於該閘極絕緣層上形成一微晶矽層;

於該微晶矽層上形成一非晶矽層;

於該非晶矽層上形成一掺雜半導體層(n+layer);

進行一第二黃光暨蝕刻製程,以去除部份之該掺雜

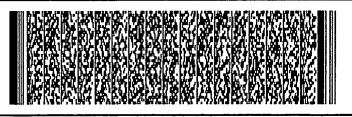
半導體層、該非晶矽層以及該微晶矽層;

於該基板上形成一第二金屬層;

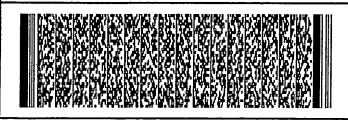
進行一第三黃光暨蝕刻製程,以於該基板表面形成該薄膜電晶體之一源極與一汲極,並同時去除部份之該掺雜半導體層,以曝露出該非晶矽層;以及

於該基板上形成一保護層。

- 2. 如申請專利範圍第1項之方法,其中該基板係為玻璃基板、石英基板或塑膠基板。
- 3. 如申請專利範圍第 1項之方法,其中構成該第一與該第二金屬層的材料係包含有鷂(W)、鉻(Cr)、鋁(A1)、銅(Cu)、鉬(Mo)或上述各金屬之合金。



- 4. 如申請專利範圍第 1項之方法,其中該閘極絕緣層係利用一電漿增強化學氣相沈積 (PECVD)製程所形成,且構成該閘極絕緣層的材料係包含有氧化矽 (SiO_x)、氮化矽 (SiN_y)或氮氧化矽 (oxynitride, SiON)。
- 5. 如申請專利範圍第 1項之方法,另包含有一氧化氮 (N₂O)電漿處理製程,用來對該閘極絕緣層進行一表面處理,以使該閘極絕緣層與後續形成之微晶矽層之介面部分含有較強之氧鍵結。
- 6. 如申請專利範圍第 1項之方法,另包含有一含氧電漿處理製程,用來對該閘極絕緣層進行一表面處理,以使該閘極絕緣層與後續形成之微晶矽層之介面部分含有較強之氧鍵結。
- 7. 如申請專利範圍第 6項之方法,其中該含氧電漿處理製程包含有氧化氮 (NO_x) 、二氧化氫 (H_2O_2) 、氧 (O_2) 、臭氧 (O_3) 或四乙氧基矽烷 (TEOS)等含氧氣體。
- 8. 如申請專利範圍第 1項之方法,其中該微晶矽層係利用一電漿增強化學氣相沈積 (PECVD)製程所形成,且該電漿增強化學氣相沈積製程的功率密度小於 0.54瓦特 /平方公分。



- 9. 如申請專利範圍第 8項之方法,其中該微晶矽層之厚度約 50至 500埃,且該微晶矽層之結晶比率 (fc)係大於40%。
- 10. 如申請專利範圍第 1項之方法,其中該閘極絕緣層、該微晶矽層、該非晶矽層皆係利用同一電漿增強化學氣相沈積 (PECVD)製程連續沈積形成。
- 11. 如申請專利範圍第 1項之方法,其中該 開極絕緣層以及 该微晶矽層係利用電漿增強化學氣相沈積製程非連續沈積形成。
- 12. 如申請專利範圍第1項之方法,其中構成該保護層之材料包含有氧化矽或氮化矽。
- 13. 一種有機發光顯示器之薄膜電晶體的製作方法,該方法包含有下列步驟:

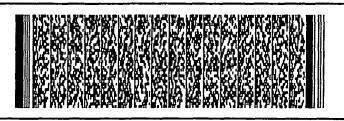
提供一基板;

於該基板上沈積一第一金屬層;

對該第一金屬層進行一第一黃光暨蝕刻製程,以於該基板表面形成該薄膜電晶體之一閘極;

於該閘極上形成一閘極絕緣層;

在該 閘極絕緣層表面進行一表面處理製程;



於該閘極絕緣層表面形成一微晶矽層;

於該微晶矽層上形成一非晶矽層;

於該非晶矽層上形成一掺雜半導體層 (n+ layer);

進行一第二黃光暨蝕刻製程,以去除部份之該掺雜半導體層、該非晶矽層以及該微晶矽層;

於該基板上形成一第二金屬層;

進行一第三黃光暨蝕刻製程,以於該基板表面形成該薄膜電晶體之一源極與一汲極,並同時去除部份之該掺雜半導體層,以曝露出該非晶矽層;以及

於該基板上形成一保護層。

- 14. 如申請專利範圍第 13項之方法,其中該表面處理製程係為一氧化氮 (N₂O)電漿製程,以使該閘極絕緣層與後續形成之該微晶矽層之介面部分含有較強之氧鍵結。
- 15. 如申請專利範圍第 13項之方法,其中該表面處理製程係為一含氧電漿製程,以使該閘極絕緣層與該微晶矽層之介面部分含有較強之氧鍵結。
- 16. 如申請專利範圍第 $15項之方法,其中該含氧電漿製程 包含有氧化氮 <math>(N0_x)$ 、二氧化氫 (H_2O_2) 、氧 (O_2) 、臭氧 (U_3) 或四乙氧基矽烷 (TEOS)等製程氣體。
- 17. 如申請專利範圍第13項之方法,其中該基板係為玻



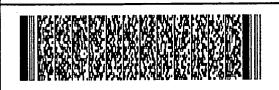
璃基板、石英基板或塑膠基板。

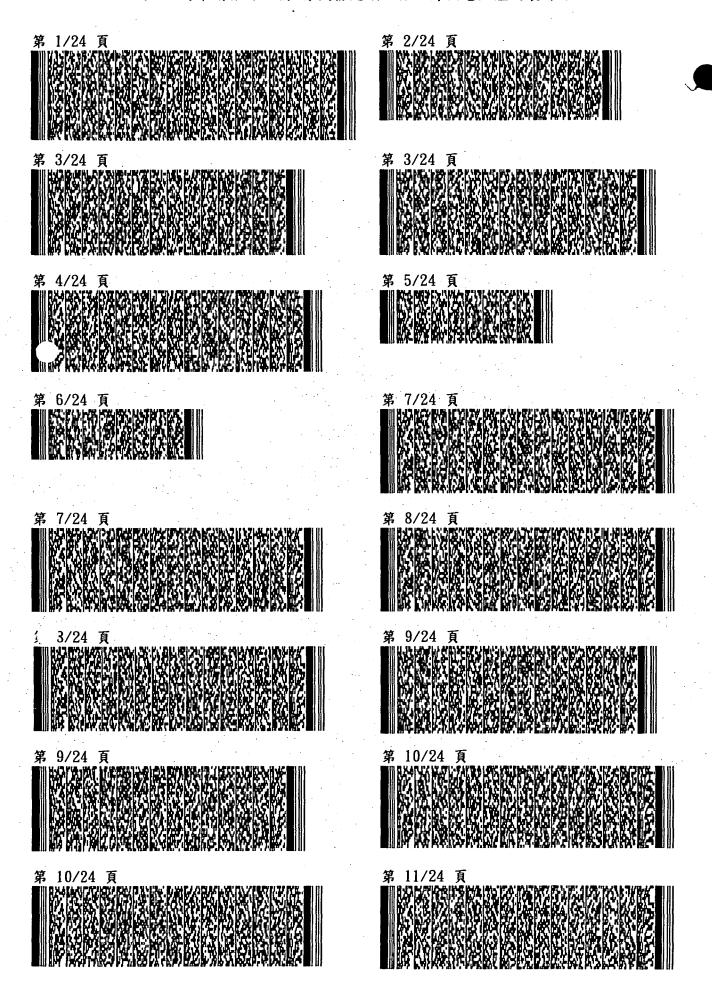
- 18. 如申請專利範圍第 13項之方法,其中構成該第一與該第二金屬層的材料係包含有鷂(W)、鉻(Cr)、鋁(A1)、銅(Cu)、鉬(Mo)或上述各金屬之合金。
- 19. 如申請專利範圍第 13項之方法,其中該閘極絕緣層係利用一電漿增強化學氣相沈積製程所形成,且構成該閘極絕緣層的材料係包含有氧化矽 (SiO_x)、氮化矽 (SiN_y)或氮氧化矽 (SiON)。
- 20. 如申請專利範圍第13項之方法,其中該微晶矽層係利用一電漿增強化學氣相沈積製程所形成,且該電漿增強化學氣相沈積製程的功率密度小於0.54瓦特/平方公分。
- 21. 如申請專利範圍第20項之方法,其中該微晶矽層之厚度約50至500埃,且該微晶矽層之結晶比率(fc)係大於40%。
- 2? 如申請專利範圍第 13項之方法,其中該 閘極絕緣層、該微晶矽層以及該非晶矽層皆係利用同一電漿增強化學氣相沈積 (PECVD)製程連續沈積形成。

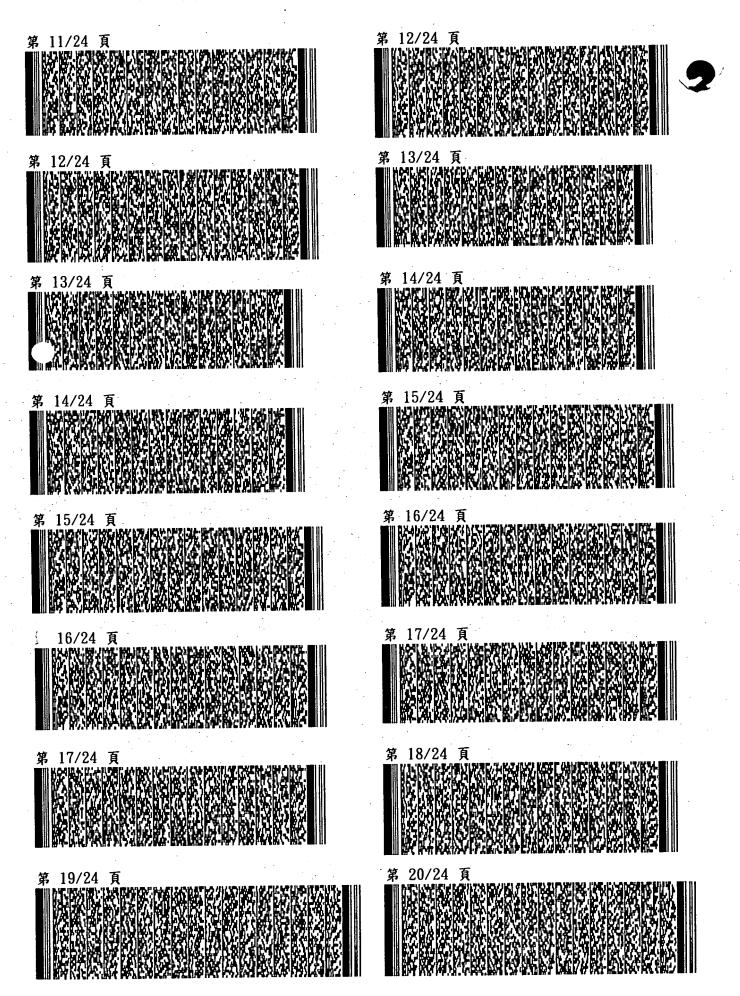


23. 如申請專利範圍第 13項之方法,其中該閘極絕緣層以及該微晶矽層係利用電漿增強化學氣相沈積製程非連續沈積形成。

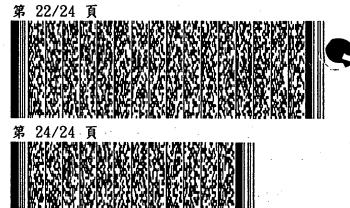
24. 如申請專利範圍第 13項之方法,其中構成該保護層之材料包含有氧化矽或氮化矽。

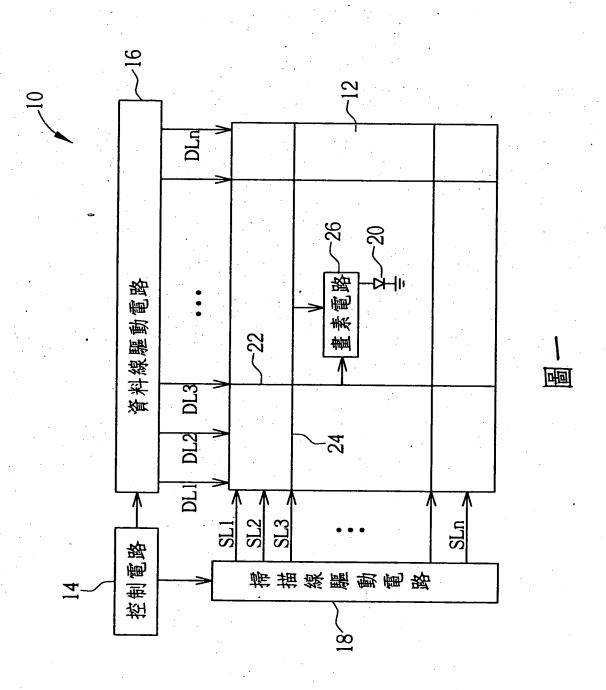












Engelle b

